

# 六氟化铀的红外吸收光谱

李庭华 侯惠奇 刘秀

(复旦大学 物理二系)

用高分辨率的 IFS-113-V 型付里叶变换红外光谱仪测定了六氟化铀  $400\text{--}4000\text{ cm}^{-1}$  区内的红外吸收光谱和  $\text{UF}_6$  分子基频  $\nu_3$  及若干合频的红外吸收光谱。用  $\text{Ti}^{3+}$  还原,  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  滴定法测得的  $\text{UF}_6$  在 0—14 托范围内, 压力与吸光度之间的关系符合比耳定律。

**关键词**  $\text{UF}_6$ , 红外吸收光谱, 分辨率。

## 一、引言

近年来, 激光分离铀同位素取得了重要进展, 特别是  $16\text{ }\mu\text{m}$  激光器研制成功后,  $\text{UF}_6$  已成为激光分离铀同位素的重要化学试剂。因此, 深入研究  $\text{UF}_6$  的红外光谱是十分重要的。

自从四十年代以来, 许多作者对  $\text{UF}_6$  的红外吸收光谱作了研究<sup>[1,5-8,10-13]</sup>。他们除了对  $\text{UF}_6$  的基频不断地进行精确测量外, 还在室温和低温条件下分别测量了基频  $\nu_3$ 、 $\nu_4$  的同位素位移<sup>[1,8]</sup>; 确定了更多的合频和倍频的较精确位置; 对基频  $\nu_3$  及  $3\nu_3$ 、 $\nu_3+\nu_4+\nu_6$  等结构进行了深入研究<sup>[8]</sup>。探讨了用红外激光激发  $\text{UF}_6$  的  $3\nu_3$ 、 $\nu_3+\nu_4+\nu_6$  及其它合频带实现铀同位素分离的可能性<sup>[1,8]</sup>。

本文给出了用 IFS-113-V 型付里叶变换红外光谱仪测得的  $\text{UF}_6$  在  $400\text{--}4000\text{ cm}^{-1}$  区内的红外吸收光谱, 记录了 7 个强吸收带, 对该频段范围内  $\text{UF}_6$  的红外活性进行了初步研究, 同时给出了  $\text{UF}_6$  基频  $\nu_3$  及若干合频的高分辨率的红外吸收光谱。用  $\text{Ti}^{3+}$  还原,  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  滴定法测得  $\text{UF}_6$  在 0—14 托范围内压力与吸光度之间的关系符合比耳定律, 讨论了实验过程中样品池的真空度, 仪器分辨率等对吸收光谱的影响。

## 一、实验部分

**1. 实验装置和仪器** 图 1 系自行设计的  $\text{UF}_6$  供料系统示意图。整个系统管道用紫铜管, 经真空检漏后, 真空度达  $\sim 10^{-2}$  托。自行设计加工的样品池池体是不锈钢的, 内外表面上镀以薄镍层。不锈钢池体联一个  $\phi 3\text{ mm}$  的  $\text{SO}_{102}$  真空阀门, 池长 12 cm, 直径 3 cm。样品池二端用  $\text{KBr}$  作窗片, 聚四氟乙烯或耐氟橡胶作密封圈。

用 IFS-113-V 型付里叶变换红外光谱仪绘制吸收光谱, 仪器最高分辨率达  $0.06\text{ cm}^{-1}$ 。

**2.  $\text{UF}_6$  纯化和实验装置钝化** 由于  $\text{UF}_6$  生产过程中, 常不可避免地引入极少量的  $\text{HF}$ 、 $\text{SiF}_4$  等, 因此  $\text{UF}_6$  在使用前应进行纯化。纯化时, 先后用干冰加乙醇的混合物及液氮作冷阱, 将  $\text{UF}_6$  反复冷凝、升华, 直到使  $\text{UF}_6$  与其固体平衡的压力和该室温下的饱和

蒸气压一致时为止<sup>[7]</sup>。

将经抛光的 KBr 窗片，衬以聚四氟乙烯或耐氟橡胶垫圈压入样品池，样品池经真空检漏合格后接在实验系统上。分别将纯 N<sub>2</sub> 和 F<sub>2</sub> 气按 1:1, 1:3, 1:6 充入系统，并保持一定时间。最后充入一定压力的 F<sub>2</sub> 气并保持 100 h 以上对装置进行钝化。以后每次样品池接入 UF<sub>6</sub> 供料系统时，都要将接口处抽真空，并用适量 UF<sub>6</sub> 清洗。

## 二、实验结果

**1. 吸收光谱的绘制** 室温下，分别在不同的压力条件，采用 4 cm<sup>-1</sup> 和 0.5 cm<sup>-1</sup> 分辨率扫描方式进行扫描。如图 2 所示，UF<sub>6</sub> 在 400—4000 cm<sup>-1</sup> 区内有 7 个吸收带。基频 ν<sub>3</sub> 和另外几个强合频带的 R 支都能清楚地与 Q 支分开。P 支多数为一肩峰，也能与 Q 支清楚地分开。除基频 ν<sub>3</sub> 外，ν<sub>2</sub>+ν<sub>6</sub>, ν<sub>2</sub>+ν<sub>4</sub> 合频带也显示了较明显的 P、R 双线结构。所记录到的吸收峰中，基频 ν<sub>3</sub> 最强，且比较窄。这表明组合频的跃迁几率比起非组合频的跃迁几率来要小得多。正因为如此，我们在实验过程中未能观察到理论计算指出的 ν<sub>3</sub>+ν<sub>4</sub>+ν<sub>6</sub> 三合频带。也未观察到文献[10]指出的 736 cm<sup>-1</sup> 吸收带。实验结果还表明，由于 UF<sub>6</sub> 在 400—4000 cm<sup>-1</sup> 区内的吸收带都比较宽，因此无论用分辨率 4 cm<sup>-1</sup> 还是 0.5 cm<sup>-1</sup> 都得画了相同的图谱。

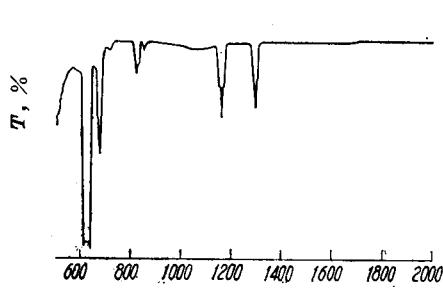


图 2 UF<sub>6</sub> 的红外吸收光谱

条件：P<sub>UF6</sub>=30 mm Hg,  
分辨率：4 cm<sup>-1</sup>；参比：抽成真空之吸收池。

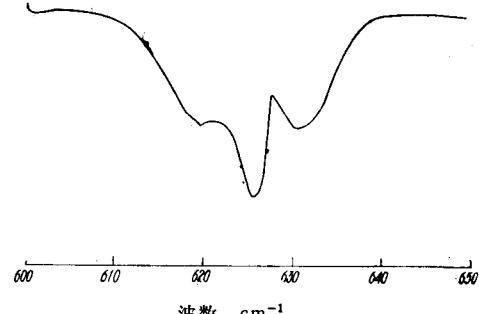


图 3 UF<sub>6</sub> ν<sub>3</sub> 带的结构  
P<sub>UF6</sub>=80 mm Hg。

UF<sub>6</sub> 在压力为 0.5 托，20°C 下，用分辨率 0.5 cm<sup>-1</sup> 绘制吸收谱，获得了图 3 所示的基频 ν<sub>3</sub> 频带的结构。由图 3 可见，基频 ν<sub>3</sub> 的 P、Q、R 三支都十分清楚地相互分开，Δν<sub>PQ</sub> 约 11 cm<sup>-1</sup>。在该实验条件下，未能观察到 UF<sub>6</sub> ν<sub>3</sub> 频带的转动谱线。

**2. UF<sub>6</sub> 在不同压力下的吸收** 文献指出，低压条件下（小于 1.7 托）UF<sub>6</sub> 的压力与吸光度之间的关系符合比耳定律。考虑到研究 UF<sub>6</sub> 的光化学条件，UF<sub>6</sub> 的实际压力不一定很低，所以我们用 Ti<sup>3+</sup> 还原，K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> 滴定法研究了 0—14 托范围内，UF<sub>6</sub> 在不同压力下与其重量之关系，以 UF<sub>6</sub> 的 ν<sub>2</sub>+ν<sub>3</sub>(1157 cm<sup>-1</sup>) 为参照标准，测定了不同压力下的 UF<sub>6</sub> 与吸光度之间关系，示于图 4。结果表明在此压力范围内，UF<sub>6</sub> 的吸光度与压力关系基本上符合

表 1  $\text{UF}_6$  在  $400\text{--}4000\text{cm}^{-1}$  区内各吸收带位置

谱带		$\nu_3$	$\nu_2 + \nu_3$	$\nu_2 + \nu_4$	$\nu_3 + \nu_5$	$\nu_1 + \nu_4$	$\nu_1 + \nu_3$	$\nu_1 + \nu_2$
中心频率, $\text{cm}^{-1}$	测量值	625.9	670.2	718.4	821.6	852.5	1157.2	1291.3
		677.0	710.5	827.4			1164.0	1297.1
文献值*	626.2	670.5	719	821.7	852.9	1157.5	1291.6	
		677.4	—	827.0		—	—	

\* 文献[13]值。

表 2  $\text{UF}_6$ ,  $\nu_3$  带的结构

$\text{UF}_6$ 压力, $\text{mmHg}$	中 心 频 率 $\text{cm}^{-1}$			
	P 支	Q 支	R 支	$\Delta\nu_{R,P}$
0.5	620.04	625.87	630.93	$10.89 \pm 0.12 \text{ cm}^{-1}$
0.9	629.68	625.14	631.65	$10.97 \pm 0.12 \text{ cm}^{-1}$

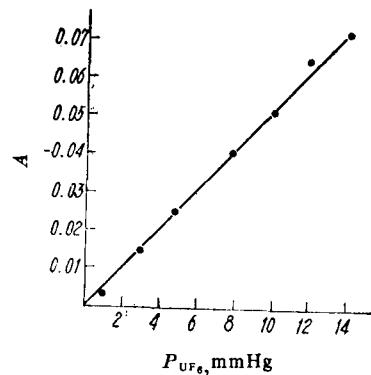
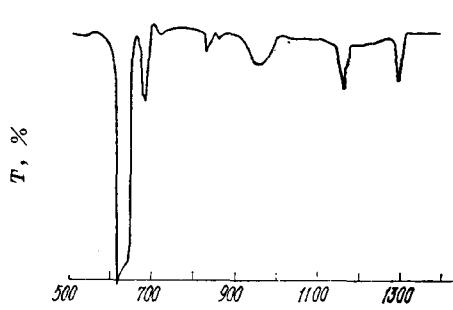
图 4 不同压力下的  $\text{UF}_6$  与吸光度关系

图 5 微量水存在时,  $\text{UF}_6$  的红外吸收光谱  
条件:  $P_{\text{UF}_6}=20 \text{ mm Hg}$ ;  $20^\circ\text{C}$ ; 样品池真空度  
 $<10^{-2}$  托; 分辨率:  $2 \text{ cm}^{-1}$ 。

比耳定律。

#### 四、讨 论

1.  $\text{UF}_6$  是化学性质很活泼的分子。 $\text{UF}_6$  和水的作用反应速度较快, 因此在实验过程, 保持样品池具有一定的真空度是很重要的。如果样品池真空度较低, 由于存在微量水,  $\text{UF}_6$  和  $\text{H}_2\text{O}$  作用生成  $\text{UO}_2\text{F}_2$  和  $\text{HF}$ 。如图 5 所示, 在  $944\text{cm}^{-1}$  左右处出现了一宽吸收带。生成的  $\text{UO}_2\text{F}_2$  粘附在样品池壁和  $\text{KBr}$  窗片上。在这种情况下, 样品池虽经长时间抽真空也无法使  $944\text{cm}^{-1}$  这一宽吸收带消除。显然, 对准确辨认  $\text{UF}_6$  各红外吸收带的位置带来了实际困难。为此, 多数作者指出,  $\text{UF}_6$  的供料系统和样品池应通过  $10^{-6}$  托的真空检漏。限于条件, 我们未在  $10^{-6}$  托真空条件下对样品池检漏。为了去除样品池中微量水, 我们将样品池放入恒温箱内, 控制一定的温度, 在恒温条件下抽真空, 使样品池的真空度高

于  $10^{-2}$  托。经过这样处理后的样品池充入  $\text{UF}_6$ ，所得  $\text{UF}_6$  红外吸收谱上 HF 吸收带消失， $944 \text{ cm}^{-1}$  处的宽吸收带也随之消失。样品池即使放置二昼夜，也未出现  $944 \text{ cm}^{-1}$  的吸收带。事实证明，经过恒温去湿处理的样品池，可在真空度不太高的条件下 ( $\sim 10^{-2}$  托) 进行  $\text{UF}_6$  红外吸收光谱的研究工作，所得结果与文献[13]一致。

2. 由于  $\text{UF}_6$  是一种球型陀螺分子，没有永久偶极，无纯转动光谱，其转动能级间的跃迁是伴随其振动跃迁产生的。因此，(1) 当  $\text{UF}_6$  分子产生振动能级的跃迁时，凡处在该振动能级上各个转动激发态的  $\text{UF}_6$  分子都可发生跃迁而产生相应的转动光谱。(2) 实际上振动分子的对称性较差，特别是几个振动模被同时激发时，简并度降低，使转动光谱数目增加。(3)  $\text{UF}_6$  基频都较低，室温条件下，处于基态分子的数目仅占总分子数的 0.4%，而处于各个激发态的分子都可以发生跃迁。因此，以  $\text{UF}_6$  为例，即使是  $\nu_3$  带，它的 P、Q、R 支实际上是由成千条以上谱线组成，实验中，我们测得  $\nu_3$  带的  $\Delta\nu_{RP}$  约  $11 \text{ cm}^{-1}$ ，所以  $\nu_3$  带的每一根转动线距约为  $10^{-3}$ — $10^{-4} \text{ cm}^{-1}$ ，显然用  $0.5 \text{ cm}^{-1}$  分辨率扫描方式扫描是无法测得  $\text{UF}_6$  各个吸收带的精细结构，这一工作要使用极高分辨率之光谱仪和在低温下方可实现。

作者对吴征铠、秦启宗先生指导，余敏、刘先年、金凤娣同志帮助进行红外光谱分析表示感谢。

### 参 考 文 献

- [1] D. M. Cox, *Spectroscopy Letters*, 12(4), 275(1979).
- [2] W. W. Rice et al., *J. Chem. Phys.*, 72(5), 2948(1980).
- [3] P. B. Амбарцумян, *Квантовая Электроника*, 6(12), 2612(1979).
- [4] J. J. 卡茨等，伍丽素等译，铀化学，化学工业出版社，卷 1, 265(1959).
- [5] H. Jetter et al., 徐芳等译，铀同位素分离，原子能出版社，23(1980).
- [6] J. K. Allen et al., 徐芳等译，铀同位素分离，原子能出版社，33(1980).
- [7] O. De Witter et al., *Laser in Chemistry*, Elsevier Scientific Publishing Company, New York, 228 (1979).
- [8] J. W. Eerkens, *Appl. Phys.*, 10, 15(1976).
- [9] IEEE, *J. Quan. Elec.*, QE, 16(4), 412(1980).
- [10] 宋文忠等，应用激光，2(1), 49(1982).
- [11] T. G. Burke, *J. Chem. Phys.*, 20, 447(1952).
- [12] H. W. Classen et al., *J. Chem. Phys.*, 53, 341(1970).
- [13] S. McDowell et al., *J. Chem. Phys.*, 61, 3571(1974).

(编辑部收到日期：1982 年 6 月 28 日)